

УДК 539.29.666

©1994

РОЛЬ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ НЕОДНОРОДНОСТИ ПОЛЯРИЗОВАННОСТИ В ФОРМИРОВАНИИ ПОЗИСТОРНОГО ЭФФЕКТА

A.H.Паевов

Существенную роль в экранировке заряженных границ кристаллитов в поликристаллических сегнетоэлектриках-полупроводниках играет пространственная неоднородность поляризованности, которая обеспечивает эффективную взаимную компенсацию связанного и свободного зарядов и вследствие этого формирование эффекта положительного температурного коэффициента сопротивления.

При переходе из сегнетоэлектрической в параэлектрическую fazу для поликристаллических сегнетоэлектриков-полупроводников наблюдается эффект положительного температурного коэффициента сопротивления (ПТКС) или позисторный эффект, который заключается в резком увеличении удельного сопротивления ρ . Эффект ПТКС обусловлен изменением при фазовом переходе φ_0 — величины потенциального барьера, который создается для подвижных носителей заряда заряженными границами кристаллитов [1]. В работах [2–4] высказывается соображение о том, что при описании φ_0 необходимо учитывать пространственную неоднородность поляризованности P . Однако расчетов пространственного распределения $P(x)$ не проводилось и оценки φ_0 выполнялись при весьма грубых предположениях о характере $P(x)$ и величине электрического поля E на границе кристаллита. Данная работа посвящена корректному учету пространственного распределения $P(x)$ при расчете величины φ_0 , которая равна значению величины потенциала φ на границе кристаллита.

Уравнения, определяющие величины E и φ , имеют вид

$$\nabla\varphi = -E, \quad (1)$$

$$\varepsilon_{\infty}\varepsilon_0\nabla E = Q - \nabla P. \quad (2)$$

Здесь ε_{∞} — величина высокочастотной (оптической) диэлектрической проницаемости, ε_0 — электрическая постоянная, Q — плотность свободного заряда.

Транспорт подвижных носителей заряда будет зависеть от того, насколько заряженные границы кристаллитов заэкранированы. Рассмотрим плоскую отрицательную заряженную границу раздела в сегнетоэлектрике-полупроводнике донорского типа, заряд которой обусловлен связанными с ней локализованными состояниями акцепторного типа [1]. Вблизи границы раздела будет существовать обедненная подвижными носителями заряда область пространственного заряда,

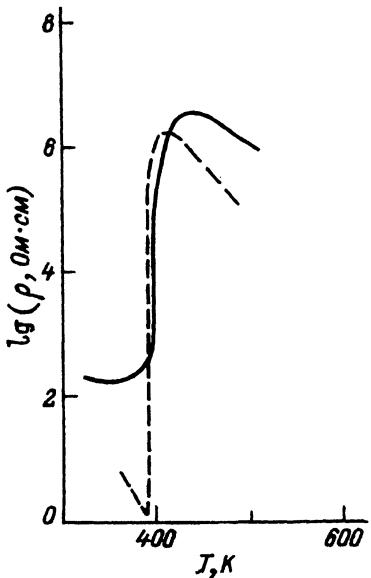


Рис. 1. Экспериментальная (сплошная линия) и теоретическая (штрихи) зависимости $\rho(T)$.

вне которой $E = 0$, а $P = P_s$ — величина спонтанной поляризованности. Линейные размеры $2l$ этой области определяются условием электронейтральности

$$2lQ = 2lqN_d = qn_s = \frac{qN_s}{1 + \exp \frac{E_F - E_s + q\varphi_0}{kT}}. \quad (3)$$

Здесь N_d — плотность доноров; N_s , E_s — плотность и энергия активации локализованных состояний на границе раздела; n_s — плотность заполненных локализованных состояний; E_F — энергия Ферми; q — заряд электрона. Выражение (3) записано для случая донорных состояний с малой энергией активации, когда плотность подвижных носителей заряда равна N_d .

Влияние на поляризованность существующего в области пространственного заряда электрического поля E , обусловленного заряженной границей раздела, учитывается в уравнении состояния P , получаемом варьированием свободной энергии, плотность которой в соответствии с феноменологической теорией сегнетоэлектрических фазовых переходов Ландау-Левоншира [5] в отсутствие механических напряжений может быть представлена в виде

$$G = \frac{1}{2}\alpha P^2 + \frac{1}{4}\beta P^4 + \frac{1}{6}\gamma P^6 + \frac{1}{2}\delta(\nabla P)^2 - EP. \quad (4)$$

Здесь

$$P = P_i + P_s,$$

где P_i — индуцированная составляющая поляризованности. Значение величины P_s определяется из уравнения состояния при $E = 0$ и $P = \text{const}$.

На рис. 1 приведены экспериментальная [6] и полученная нами теоретическая кривые $\rho(T)$ для BaTiO_3 в случае $E \uparrow \uparrow P_s$ антипараллель-

Таблица 1

Значение диэлектрической проницаемости ϵ и удельного сопротивления ρ (Ом·см) для разных соотношений направлений спонтанной поляризованности и электрического поля границы раздела

$(\uparrow\downarrow)(\uparrow\downarrow)$	$(\uparrow\uparrow)(\uparrow\downarrow)$	$(\uparrow\uparrow)(\uparrow\uparrow)$	ϵ_c^0	$\epsilon_{\text{п}}^0$	$\epsilon_{\text{п}}^0$
$\tilde{\epsilon}$					
$1.4 \cdot 10^4$	$4.7 \cdot 10^2$	$1.2 \cdot 10^4$	10^3	$4.8 \cdot 10^3$	$3.0 \cdot 10^3$
	$\tilde{\rho}_c$		ρ_c^0	$\tilde{\rho}_{\text{п}}$	$\rho_{\text{п}}^0$
6.5	$1.7 \cdot 10^9$	$4.3 \cdot 10^1$	$7.7 \cdot 10^8$	$2.0 \cdot 10^6$	$7.4 \cdot 10^5$

ного расположения E и P_s по обе стороны границы раздела. Теоретическая зависимость $\rho(T)$ рассчитана по формуле, которая учитывает наличие потенциальных барьеров, обусловленных локализованными состояниями на границе раздела [7]

$$\rho = \rho_0 \left(1 + \frac{2lkT}{Lq\varphi_0} \exp \frac{q\varphi_0}{kT} \right). \quad (5)$$

Здесь L — толщина кристаллита, $\rho_0 = (qN_d\mu)^{-1}$ — величина удельного сопротивления в объеме кристаллита за пределами области пространственного заряда, μ — подвижность электронов.

Как видно из рис. 1, между теоретической и экспериментальной зависимостями имеется согласие. Удается получить малое значение сопротивления в сегнетофазе и большое в парафазе и, таким образом, описать скачок сопротивления при температуре фазового перехода, т.е. описать позисторную аномалию. В качестве интегральной характеристики поведения сегнетоэлектрической системы используем $\tilde{\epsilon}$ — эффективную диэлектрическую проницаемость, определяемую соотношением

$$-\varphi_0 = \frac{qn_s^2}{8\epsilon_0\tilde{\epsilon}N_d}. \quad (6)$$

В табл. 1 приведены значения $\tilde{\epsilon}$ и рассчитанные по формуле (5) значения $\tilde{\rho}_c$ для BaTiO_3 при $T = T_1 - 30$, где T_1 — температура фазового перехода, при разных соотношениях направлений E и P_s по обе стороны границы раздела. Обозначения $(\uparrow\downarrow)(\uparrow\downarrow)$ и $(\uparrow\uparrow)(\uparrow\downarrow)$ соответствуют случаям $E \uparrow\downarrow P_s$ и $E \uparrow\uparrow P_s$ по обе стороны границы раздела. Обозначение $(\uparrow\uparrow)(\uparrow\uparrow)$ соответствует случаю, когда по одну сторону границы раздела $E \uparrow\uparrow P_s$, а по другую — $E \uparrow\downarrow P_s$. Из табл. 1 видно, что экранировка φ и тем самым величина ρ зависят от взаимного направления E и P_s . Таким образом, экспериментально определяемая величина ρ зависит от пространственного распределения P в поле заполненных локализованных состояний границы раздела, т.е. от мезоскопической структуры P вблизи границы раздела.

Кроме того, в табл. 1 приведены ϵ_c^0 , ρ_c^0 — значения диэлектрической проницаемости и удельного сопротивления ρ в сегнетофазе для температуры $T = T_1 - 30$, рассчитываемые в приближении однородности P ; $\tilde{\epsilon}_{\text{п}}$ — значение $\tilde{\epsilon}$ в парафазе для температуры, при которой величина ρ ,

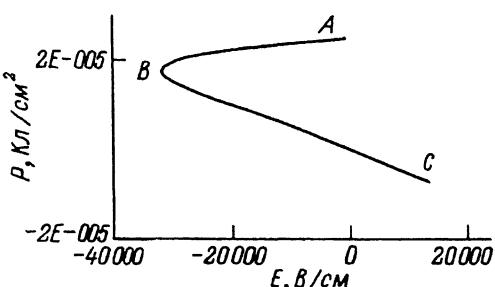


Рис. 2. Зависимость $P(E)$ при $(\uparrow\downarrow)(\downarrow\uparrow)$.
 $T = T_1 - 30$, $P_s \uparrow\downarrow E$.

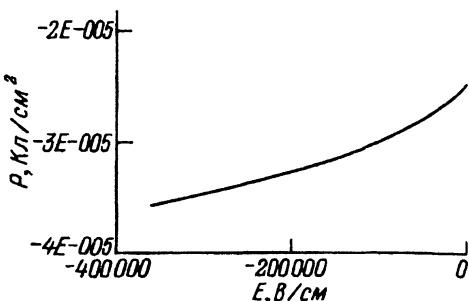


Рис. 3. Зависимость $P(E)$ при $(\uparrow\uparrow)(\uparrow\uparrow)$.
 $T = T_1 - 30$, $P_s \uparrow\uparrow E$.

расчитываемая с учетом неоднородного распределения P , достигает максимального значения $\bar{\rho}_n$; ε_n^0 — значение диэлектрической проницаемости в парафазе для температуры, при которой величина ρ , рассчитываемая в приближении однородного распределения P , достигает максимального значения ρ_n^0 .

Величина ε_n^0 определяется выражением (7), а величина ε_c^0 — выражением (8) при $P = P_s$

$$\varepsilon_n = \frac{C}{T - T_0}, \quad (7)$$

$$\varepsilon_c = \frac{1}{\varepsilon_0(\alpha + 3\beta P^2 + 5\gamma P^4)}. \quad (8)$$

Термодинамические параметры BaTiO_3 определялись исходя из $T_1 = 391.9$, $T_0 = 389$ К, $P_s(T_1) = 15.5 \cdot 10^{-6}$ Кл·см $^{-2}$, $C = 1.7 \cdot 10^5$ град [4], $\delta = 2 \cdot 10^{-15}$ см $^{-2}$ [5]. В качестве граничных условий принималось, что на границе области пространственного заряда $P = P_s$, $E = 0$, $\varphi = 0$ [2-4]. Расчеты проводились при $N_d = 10^{19}$ см $^{-3}$, $N_s = 4 \cdot 10^{14}$ см $^{-2}$, $E_s = 1$ эВ [1], $L = 10^{-3}$ см [4], $\varepsilon_\infty = 3$ [8], $\mu = 0.45$ см $^2 \cdot \text{В}^{-1} \cdot \text{с}^{-1}$ [4].

Из табл. 1 следует, что в сегнетофазе для случая $(\uparrow\downarrow)(\downarrow\uparrow)$ удельное сопротивление $\bar{\rho}_c$ много меньше, чем его максимальное значение в парафазе. Для величины ρ_c^0 соотношение обратное. Таким образом, появление позисторной аномалии позволяет описать учет неоднородного распределения P . При этом оказывается существенным соотношение направлений E и P_s . В случае $(\uparrow\uparrow)(\downarrow\downarrow)$, который моделирует поляризованное состояние сегнетоэлектрика, ρ_c больше, чем для случая $(\uparrow\downarrow)(\uparrow\downarrow)$, моделирующего неполяризованное состояние, что соответствует экспериментальной ситуации [9].

О причинах различия экранировок при разных взаимных направлениях E и P_s , можно заключить из рис. 2, 3, где приведены зависимости $P(E)$. В случае $E \uparrow\downarrow P_s$ (рис. 2) наблюдается переполяризация, т.е. изменение направления P , причем имеется участок BC , который обычно на петлях гистерезиса трактуется как метастабильное, не обнаруживаемое экспериментально при однородном распределении P состояние [5]. В нашей ситуации это состояние реализуется в силу того, что исследуемая система является неавтономной, т.е. каждая точка на кривой $P(E)$ в нашем случае соответствует определенной пространствен-

Таблица 2

Значения E_{cp} , ϵ_c^{cp} , n_s , n_s^{Φ}

	E_{cp} , В · см $^{-1}$	ϵ_c^{cp}	n_s , см $^{-2}$	n_s^{Φ} , см $^{-2}$
(↑↓)(↑↓)	$1.3 \cdot 10^4$	$2.0 \cdot 10^4$	$4.0 \cdot 10^{14}$	$1.3 \cdot 10^{10}$
(↑↑)(↑↑)	$1.4 \cdot 10^5$	$4.4 \cdot 10^2$	$1.4 \cdot 10^{14}$	$6.2 \cdot 10^{11}$

ной точке. В случае $E \uparrow\downarrow P_s$ (рис. 3) имеем монотонное возрастание P при возрастании E , т.е. поляризационный процесс. Переполяризационный процесс сопровождается по сравнению с поляризационным большими величинами абсолютного значения локальной диэлектрической проницаемости ϵ_c , рассчитываемой по формуле (8), что подтверждается данными табл. 2, где приведены ϵ_c^{cp} — средние значения абсолютных величин ϵ_c для разных взаимных ориентаций E и P_s , а также видно из сопоставления рис. 4 для случая $(\uparrow\downarrow)(\uparrow\downarrow)$ и рис. 5 для случая $(\uparrow\uparrow)(\uparrow\uparrow)$, на которых приведены значения ϵ_c в зависимости от x -расстояния до границы раздела. Таким образом, в случае $E \uparrow\downarrow P_s$ сегнетоэлектрическая система наиболее сильно реагирует на внешнее воздействие и поэтому эффективней всего его экранирует. Это подтверждают данные по среднему значению абсолютной величины электрического поля E_{cp} (табл. 2). Абсолютные значения ϵ_c вблизи поверхности кристаллита (точка $x = 0$ на рис. 4, 5) много меньше максимальных абсолютных значений ϵ_c в объеме, что соответствует ряду экспериментальных фактов [10].

Как видно из табл. 1, учет пространственной неоднородности P может приводить к значительному отличию $\tilde{\epsilon}$ от ϵ_c^0 , рассчитанному в приближении однородного распределения P . При этом выполняется

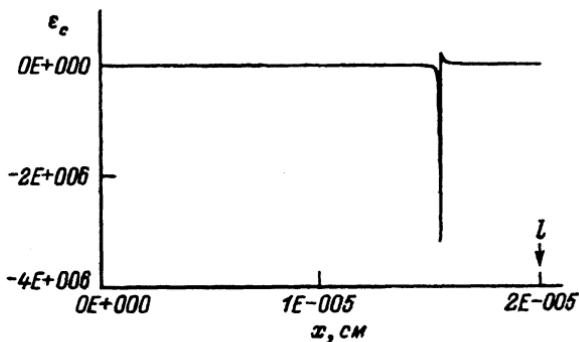
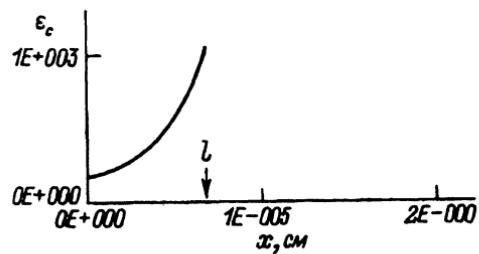
Рис. 4. Зависимость $\epsilon_c(x)$ при $(\uparrow\downarrow)(\uparrow\downarrow)$. $T = T_1 - 30$, $P_s \uparrow\downarrow E$.Рис. 5. Зависимость $\epsilon_c(x)$ при $(\uparrow\uparrow)(\uparrow\uparrow)$. $T = T_1 - 30$, $P_s \uparrow\uparrow E$.

Таблица 3

Значения $\tilde{\epsilon}_n$, ϵ_n^0 и $\tilde{\rho}_n$, ρ_n^0 (Ом·см)

$T = T_1$				$T = T_1 + 100$			
$\tilde{\epsilon}_n$	ϵ_n^0	$\tilde{\rho}_n$	ρ_n^0	$\tilde{\epsilon}_n$	ϵ_n^0	$\tilde{\rho}_n$	ρ_n^0
$5.8 \cdot 10^3$	$6.0 \cdot 10^4$	$1.3 \cdot 10^5$	1.4	$1.7 \cdot 10^3$	$1.7 \cdot 10^3$	$4.2 \cdot 10^4$	$1.1 \cdot 10^5$

соотношение $dP/dx \sim qN_d$. Это приводит к почти полной компенсации плотностей qN_d свободного и dP/dx связанного зарядов и вследствие этого к соотношению $dE/dx \sim 0$ в значительной части области пространственного заряда. Таким образом, вследствие наличия пространственного распределения P явление экранировки заряженной границы сводится к тому, что эффективная плотность пространственного заряда $Q_{\text{эфф}} = qN_d - qP/dx$ становится гораздо меньше, чем qN_d . В результате эффективная величина заэкранированного заряда на границе раздела $qn_s^{\Phi} = \int Q_{\text{эфф}} dx$, как следует из табл. 2, оказывается существенно меньше исходного заряда qn_s . Разный характер экранирования для приближений однородного и неоднородного распределений $P(x)$ скрывается также в параэлектрической фазе (табл. 3) особенно вблизи от $T = T_1$, когда значительны нелинейные свойства сегнетоэлектрической системы. Вдали от точки фазового перехода в парафазной области при ослаблении роли нелинейных членов термодинамического потенциала результаты, полученные в приближениях однородного (ϵ_n^0 , ρ_n^0) и неоднородного ($\tilde{\epsilon}_n$, $\tilde{\rho}_n$) распределения P различаются мало.

Из табл. 2, где приведены $E_{\text{ср}}$, $\epsilon_c^{\text{ср}}$ — усредненные величины E и ϵ_c для $T = T_1 - 30$, следует, что для случая $(\uparrow\downarrow)(\uparrow\downarrow)$ поле $E_{\text{ср}}$ меньше расчетной величины коэрцитивного поля, равной для данной температуры $3.1 \cdot 10^4$ В·см $^{-1}$. Из рис. 2 следует, что поле в области пространственного заряда для случая $(\uparrow\downarrow)(\uparrow\downarrow)$ ограничено по величине значением коэрцитивного поля. Таким образом, приближение, сделанное нами в работах [11, 12], когда поле в области пространственного заряда полагалось равным коэрцитивному, дает верхний предел оценки величин E , φ , ρ для неполяризованного состояния.

Таким образом, экранирование заряженных границ раздела в сегнетоэлектриках-полупроводниках и тем самым формирование эффекта ПТКС в существенной степени определяются пространственным распределением поляризованности, причем наиболее эффективная экранировка происходит в случае переключения направления поляризованности в электрическом поле границ раздела.

Список литературы

- [1] Heywang W. // J. Amer. Ceram. Soc. 1964. V. 47. N 10. P. 484–490.
- [2] Kulwicki B.M., Purdes A.J. // Ferroelectrics. 1970. V. 1. P. 253–263.
- [3] Шустров Б.А., Шефтель И.Т., Ярмаркин В.К. // ДАН СССР. 1987. Т. 293. № 6. С. 1378–1383.
- [4] Nang D.Y., Umeaga K. // J. Amer. Ceram. Soc. 1990. V. 73. N 6. P. 1574–1581.
- [5] Смоленский Г.А., Боков И.А. и др. Сегнетоэлектрики и антисегнетоэлектрики. Л.: Наука, 1971. 476 с.
- [6] Desu S.B., Payne D.A. // J. Amer. Ceram. Soc. 1990. V. 73. N 11. P. 3416–3421.

- [7] Jonker G.H. // Solid State Electron. 1964. V. 7. N 12. P. 895–903.
- [8] Поляроны. Сб. / Под ред. Ю.А.Фирсова. М.: Наука, 1975. 423 с.
- [9] Раевский И.П., Бондаренко И.И., Павлов А.Н., Прокопало О.И., Тарасенко П.Ф. // ФТТ. 1984. Т. 26. № 4. С. 1219–1221.
- [10] Фридкин В.М. Сегнетоэлектрики–полупроводники. М.: Наука. 1976. 408 с.
- [11] Бондаренко И.И., Павлов А.Н., Раевский И.П., Прокопало О.И., Емельянов В.М., Тарасенко П.Ф. // ФТТ. 1985. Т. 27. № 8. С. 2530–2533.
- [12] Raevskii I.P., Pavlov A.N., Prokopalo O.I., Bondarenko E.I. // Ferroelectrics. 1988. V. 83. P. 171–178.

Ростовский государственный университет НИИФ
г.Ростов-на-Дону

Поступило в Редакцию
14 мая 1993 г.